

AVISO DE NOTIFICACION

0103/

CORREO CERTIFICADO

Bogotá D.C.

Radicacion : 00016309 00000002 Folios :001
Fecha (AMD) : 2003-10-28 09:41:48
Tramite : 003 PATENTES DE MODEL
Evento : 001 REGISTRO/DEPOSITO
Actuacion: 432 RESOLUCION

Doctor(a)
ANGARITA DE MUNEVAR LUZ MARY
CARRERA 13 NO. 32-51 OF. 602
BOGOTA D.C

REF: RESOLUCION No. 30040
FECHA: 27/10/2003
EXPEDIENTE No. 0 16309 000
Tramite: 3 PATENTES DE MODELO DE UTI
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION
Actuac.: 432 RESOLUCION

Estimado doctor(a):

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto(5), de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución y expediente citados en la referencia.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la patente de Modelo de Utilidad a:

Jaime German Sanchez Rodriguez

Dogeta S. E., Colombia

En la Reación denominada:
"Parasol facial"

Inventor(es):

Jaime German Sanchez Rodriguez

Certificado No 338

Clasificación Internacional: A45B09/00

4

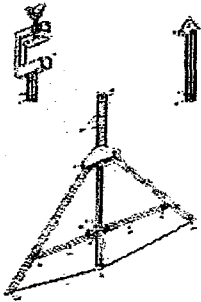
Reivindicaciones

de Patentes

Vigente Desde: 03/07/2000

Expira: 03/07/2010

Utilidad No:



Que la solicitud de patente de Modelo de Utilidad No 0 016309 , cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales Resolución No 30040 de 10/27/2003 , en testimonio de ello se estampó la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
N° Radicación	000 16309	Fecha de presentación	07-03-2000
N° Prioridad		Fecha de Prioridad	

Palabras clave	

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA			
A45B 9/00	E04H 15/28		
A45B 25/00	E04H 15/44		

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES			
Patente Original			

BASES DE DATOS CONSULTADAS			
DEPM	ESPACENET		
SIC			
GLOBALPAT			

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reiv. afectadas

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reiv. afectadas

LITERATURA NO PATENTES		
Documento	Relevancia	Reiv. afectadas

Observaciones	

Fecha del examen	16-12-01/2003
------------------	---------------